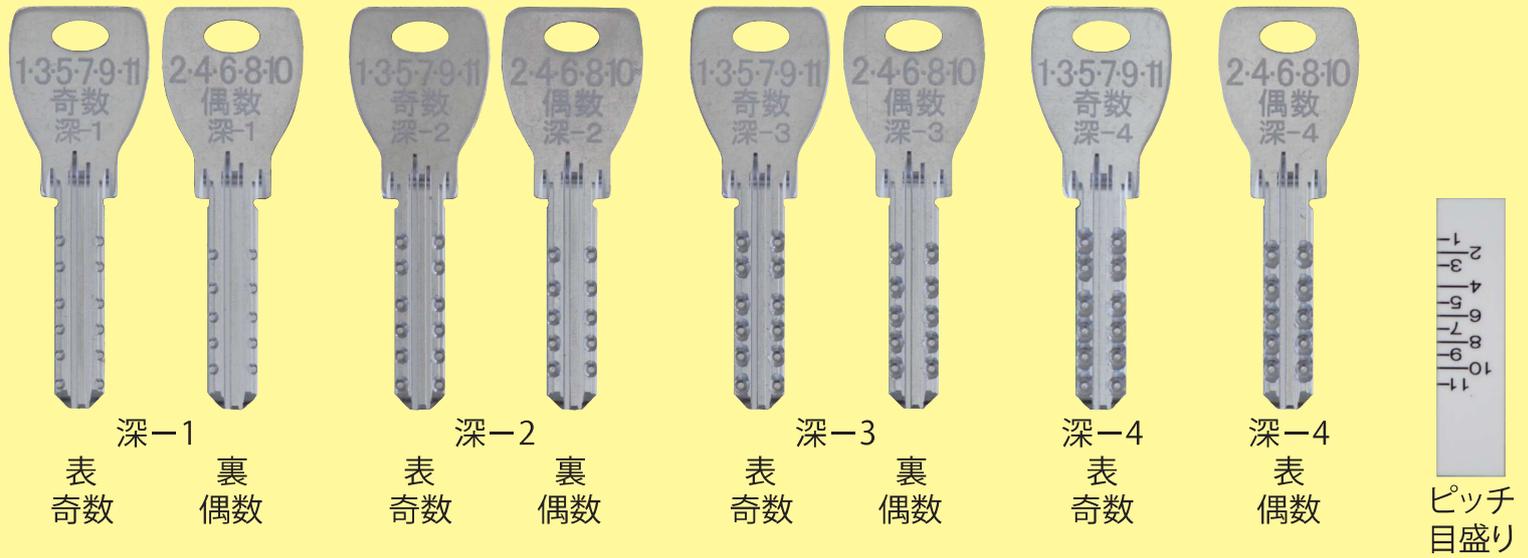
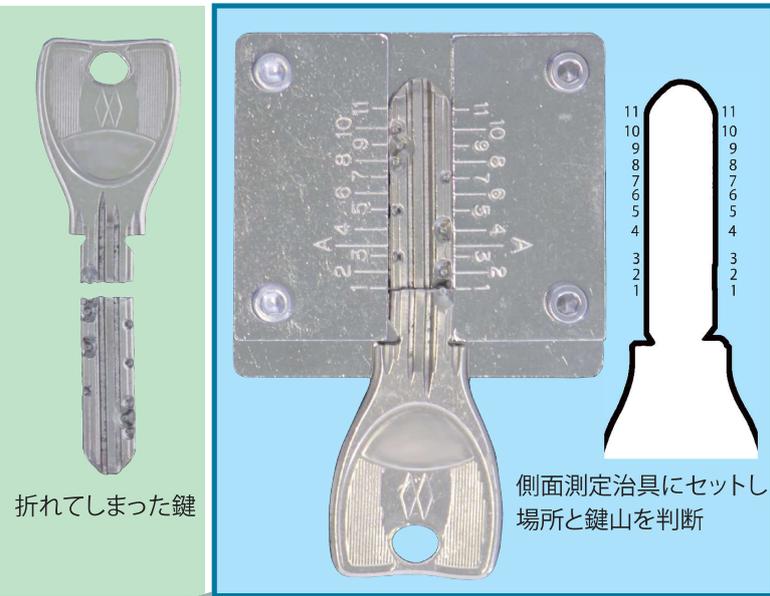


F204 サンプルキー5本セット ※ PSキーW印も対応可能



- 用途
- 折れてしまった鍵から合鍵を作製
 - 鍵の画像から合鍵を作製
 - すり減った純正キーからの複製
 - 合鍵からの複製
 - 開錠治具の作製(鍵作製)



折れてしまった鍵

側面測定治具にセットし場所と鍵山を判断

- 折れてしまった鍵から合鍵を作製する手順
※すり減った純正キーからの複製や合鍵からの複製も同様の手順で可能です。

側面測定治具を使用し目視で場所と鍵山(1・2・3・4)を判断。
(メモなどに書いておくと作業が楽になります)

画像では左側 3-深1 5-深1 8-深2 9-深4 10-深2
右側 1-深4 2-深3 4-深3 7-深1
側面 5-浅 7-浅 (治具で目視)

作製時にはP R複製専用開発されたカッター(PDCW・PDCW-K)およびガイド8のご使用をお勧めします。

MATRIX (SLX・SX・Pro・Evo)で加工する場合はオプションのL型バイス治具(側面加工ゲージ使用時は必須)のご使用をお勧めします。



サンプルキーを使用し平面の鍵穴をカット
(表裏の両面をカット)



折れた鍵から合鍵を作製できました

側面は平面サンプルキーや側面加工ゲージでカット
(左右をカット)



● 鍵の画像から合鍵を作製する手順

※SMSやEメール、LINEなどで送られた画像から作製する。

画像の鍵山を目視で場所と鍵山(1・2・3・4)を判断。
(メモなどに書いておくと作業が楽になります)
原寸大にして確認すると作製ミスを減らせます。

画像では左側 4-深2 6-深1

右側 1-深2 2-深3 8-深4 10-深2 11-深2

側面 3-深 9-浅

鍵山の作製は折れてしまった鍵から合鍵を作製する手順と同様に行ってください。

● 開錠治具の作製(鍵作製)については、読み取った鍵山をサンプルキーや側面加工ゲージ等で加工して作製してください。

なお、読み取り方法等についてお問い合わせいただきましてもお答えできません。ご了承ください。

製作時に推奨するカッター・ガイド・治具等



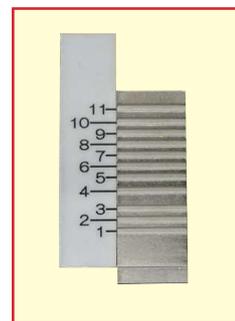
【カッター】
PDCW(ハイス)
PDCW-K(超硬)

【ガイド】
8
φ6×42mm



L型バイス治具
MATRIX
SLX/SX/Pro/Evo

標準バイスではバイス幅が狭くて平行にバイスできない鍵にも使用できます。



側面加工ゲージ

側面測定治具で調べた位置深さをディンプルマシンで加工するゲージです。



側面測定治具

平面や側面の鍵山の位置と深さ(側面)を測定する治具です。



平面サンプルキー

側面測定治具で調べた側面の位置や深さを平面マシンで加工するサンプルキーです。

ご注意



上部画像の↑部のように、平面のディンプルで深さが3番目・4番目の場合で側面ディンプルが同じ位置にある場合は、純正キーでもエントランスや裏口等の共用部シリンダーで鍵が抜けなくなる事例が頻発しています。お客様のお持ちになった鍵がこのパターンの場合には合鍵作製でなく純正キー取寄せで対応してください。



動画はこちら